



تأسیس ۱۳۰۷

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

رساله

برای دریافت درجه دکترا

مخابرات - میدان

تحلیل موجبرهای نوری سه لایه شامل پلاسمون - پلاریتون‌های سطحی در حضور اثرات مگنتوآپتیک

استاد راهنما:

دکتر نصرتا ... گرانیپایه

نگارش:

مهدی خطیر

بهمن ۱۳۹۱



تقدیم بہ

پروردگار مہربان، آفریدگار، مستی،

پدرم بہ استواری کوه،

مادرم بہ زلالی چشمہ،

ہمسرم بہ صمیمیت باران،

ودخترم بہ طراوت شبنم

ہمہ مردم سرزینم،

ہمہ معلمین دوران تحصیلم،

استاد علم و اخلاقم جناب آقای دکتر کرانی،

تاییدیه هیات داوران

اعضای هیات داوران، نسخه نهایی پایان نامه آقای مهدی خطیر

با عنوان:

تحلیل موجبرهای نوری سه لایه شامل پلاسماون پلاریتون های سطحی در حضور اثرات

مگنتواپتیک

از نظر فرم و محتوی بررسی نموده و پذیرش آن را برای تکمیل درجه دکتری تایید می نمایند.

اعضای هیات داوران نام و نام خانوادگی رتبه علمی امضاء

۱- استاد راهنما دکتر نصرتا... گرانیپه دانشیار

۲- استاد ممتحن دکتر سید عبدا... میرطاهری دانشیار

۳- استاد ممتحن دکتر محمدصادق ابریشمیان دانشیار

۴- استاد ممتحن دکتر محمد مهدی طهرانچی استاد

۵- استاد ممتحن دکتر محمود شاه آبادی استاد

۶- نماینده تحصیلات تکمیلی دکتر تورج امرایی استادیار

اظهارنامه دانشجو

موضوع پایان نامه: تحلیل موجبرهای نوری سه لایه شامل پلاسماون پلاریتون های سطحی در
حضور اثرات مگنتواپتیک

استاد راهنما: دکتر نصرت... گرانیپایه

نام دانشجو: مهدی خطیر

شماره دانشجویی: ۸۷۰۰۹۴۶

اینجانب مهدی خطیر دانشجوی دوره دکتری مهندسی برق گرایش مخابرات (میدان و موج)
دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی گواهی می نمایم که تحقیقات ارائه
شده در این پایان نامه توسط شخص اینجانب انجام شده و صحت و اصالت مطالب نگارش شده مورد
تایید است، و در مورد استفاده از کار دیگر محققان به مرجع مورد استفاده اشاره شده است. بعلاوه
گواهی می نمایم که مطالب مندرج در پایان نامه تاکنون برای دریافت هیچ نوع مدرک یا امتیازی توسط
اینجانب یا فرد دیگری در هیچ جا ارائه نشده است و در تدوین متن پایان نامه چارچوب (فرمت)
مصوب دانشگاه را بطور کامل رعایت کرده ام.

امضاء دانشجو:

تاریخ:

فرم حق طبع و نشر و مالکیت نتایج

- ۱- حق چاپ و تکثیر این پایان نامه متعلق به نویسنده آن است. هرگونه کپی برداری بصورت کل پایان نامه یا بخشی از آن تنها با موافقت نویسنده یا کتابخانه دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی مجاز است.
- ۲- کلیه حقوق معنوی این اثر متعلق به دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی است و بدون اجازه کتبی دانشگاه به شخص ثالث قابل واگذاری نیست.
همچنین استفاده از اطلاعات و نتایج موجود در پایان نامه بدون ذکر مرجع مجاز نیست.

تقدیر و تشکر

شکر و سپاس خدا را که بزرگترین امید و یاور، در لحظه لحظه زندگی است. او که هستی مان بخشید و به طریق علم و دانش رهنمونمان شد و به همنشینی رهروان علم و دانش مفتخرمان نمود و خوشه چینی از علم و معرفت را روزیمان ساخت.

پس از ستایش پروردگار مهربان، از استاد گرانقدر و فرزانه، جناب آقای دکتر نصرت... گرانپایه صمیمانه سپاسگزاری می نمایم که بی تردید، بدون نظارت و راهنمایی های ایشان، این مجموعه به سرانجام شایانی نمی رسید. معلمی دلسوز و مهربان که علاوه بر حمایت های علمی، از سجایای اخلاقی شان نیز بهره فراوان بردم که شاگردی ایشان برای من افتخاری بزرگ است که همواره خداوند را برای آن شاکرم.

از اساتید بزرگوار جناب آقایان دکتر محمدصادق ابریشمیان و دکتر منوچهر کامیاب کمال تشکر را دارم که با راهنمایی های ارزنده، راه را برایم هموار نمودند.

از اساتید محترم جناب آقایان دکتر سید عبدا... میر طاهری، دکتر محمود شاه آبادی، دکتر محمد مهدی طهرانچی و دکتر تورج امرایی که قبول زحمت نمودند و در جلسه ارزیابی رساله حضور داشتند، نیز سپاسگزاری می نمایم.

از کلیه کارکنان محترم آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه و دانشکده، از جمله جناب آقای داوودزاده، سرکارخانم عینی، سرکارخانم نوروزی، سرکارخانم ارفاقی، سرکارخانم مؤمنی و سرکار خانم عزیزی صمیمانه سپاسگزارم و قدردان زحمات های بی دریغ آنها هستم.

از کلیه همکاران و دوستانم در مرکز کنترل شرکت ارتباطات سیار و شرکت مهندسی مشاور طرح ارتباطات از جمله آقایان مهندس عبدا... قاسمی، حسین حجتی زاده و عزیزا... حسینخانی بدلیل همکاری شان در دوران تحصیل و آقایان مهندس محمد رادفر، محمد جواد مشفق و سرکارخانم فاطمه قبادیان بدلیل کمک شان در تهیه این مجموعه و آقایان مهندس مجید جعفری جورجاده، حامد قبادیان، بابک رجبی، مجید خطیر و محمد جواد خطیر و کلیه دوستانم در آزمایشگاه مخابرات نوری و دانشجویان دکتری، بدلیل همکاری شان در برگزاری جلسه دفاع کمال تشکر را دارم.

همچنین از کلیه افراد خانواده ام، پدر، مادر و به ویژه همسر مهربان و دختر دلبندم که همواره مشوق من در ادامه راه بودند و با صبر و شکیبایی به تنهایی بار سنگین زندگی را در دوران تحصیل بدوش کشیده اند، قدردانی فراوان می نمایم و در پایان، توفیق همه علاقمندان و جویندگان علم و دانش را از خداوند بزرگ خواستارم.

چکیده

کاهش ابعاد ادوات نوری معمولی برای استفاده در ساختارهای نانوآپتیک بدلیل پراش نور دارای محدودیت است، اما این مشکل را با استفاده از پلاریتون‌های پلاسمون سطحی می‌توان حل نمود و از فیلم‌های نازک فلزی و عایق به‌عنوان موجبر برای هدایت پلاسمون‌های سطحی استفاده کرد. استفاده از مواد مگنتوآپتیک در ساخت موجبرهای پلاسمونیک، قابلیت‌های جدیدی ایجاد می‌کند که می‌توان در طراحی و ساخت ادوات نوری در مقیاس نانو بکار برد.

در این رساله، پس از مروری کوتاه بر فعالیت‌های انجام شده در موجبرهای پلاسمونیک معمولی و مگنتوآپتیک و استفاده از آنها در طراحی و ساخت ادوات نوری، شرایط تحریک پلاریتون‌های پلاسمون سطحی مورد بررسی قرار می‌گیرد و به‌منظور کاهش حجم محاسبات و افزایش سرعت پردازش، از مدل درود برای شبیه‌سازی رفتار فلزات در طول موج‌های بلندتر از طول موج قرمز استفاده می‌شود.

به‌منظور تحلیل موجبرهای لایه ای پلاسمونیک در حضور اثرات مگنتوآپتیک، رابطه‌های پاشندگی حاکم بر موجبر لایه‌ای برای دو ساختار عرضی و طولی و با در نظر گرفتن اثر مگنتوآپتیک در ترکیب‌های مختلف لایه‌ها، محاسبه می‌شوند و سپس به کمک روش‌های عددی مناسب، رفتار انتشاری موجبرهای پلاسمونیک مگنتوآپتیک و شرایط انتشار مدهای زوج و فرد پلاسمونیک بررسی و تحلیل می‌شوند.

از روش دو قسمتی برای تأیید نقاط حدس و محاسبه دقیق‌تر ریشه‌های مختلط معادله مشخصه استفاده می‌شود که در ترکیب با یک الگوریتم ساده و ابتکاری، سرعت و دقت محاسبات را تا چندین برابر افزایش می‌دهد.

با انتخاب روش عددی تفاضل محدود در حوزه زمان و ترکیب با تبدیل Z و استخراج رابطه‌های حاکم بر ساختارهای ناهمسانگرد مورد مطالعه، الگوریتم لازم برای محاسبه مؤلفه‌های میدان‌های الکترومغناطیسی آماده می‌شود.

با استفاده از ویژگی‌های منحصربفرد موجبرهای پلاسمونیک در کاهش ابعاد ادوات نوری در کنار قابلیت‌های مواد مگنتوآپتیک، ادوات جدید و بهینه نوری پیشنهاد می‌شوند. مبدل TM به TE با استفاده از یک موجبر فلز-عایق-فلز¹ مگنتوآپتیک با بایاس طولی با قابلیت تمرکز بالای موج در بخش مرکزی موجبر، تحلیل می‌شود. یک سویچ پلاسمون سطحی مگنتوآپتیک با ابعاد کوچک و سرعت بالا پیشنهاد، طراحی و بررسی می‌شود. همچنین نشان داده می‌شود که برای مدهای زوج در ساختار نامتقارن می‌توان با ایجاد اختلاف در ضریب شکست لایه‌ها امکان قطع مد را فراهم کرد که می‌تواند مبنای طراحی ادوات پلاسمونیک جدید باشد. امکان سنجی طراحی ایزولاتور پلاسمونیک مگنتوآپتیک با استفاده از موجبرهای سه لایه‌ای عایق-فلز-عایق² و MIM انجام می‌شود و نشان داده می‌شود که در طراحی ایزولاتور، طول انتشار عامل محدود کننده، برای دستیابی به ایزولاسیون بالاست.

کلمات کلیدی: موجبر پلاسمونیک، اثرات مگنتوآپتیک، رابطه‌ی پاشندگی، مبدل مد، سویچ، ایزولاتور، شرایط قطع مد، روش عددی تفاضل محدود در حوزه زمان، تبدیل Z، مواد ناهمسانگرد.

¹ Metal-Insulator-Metal (MIM)

² Insulator-Metal-Insulator (IMI)

فهرست مطالب‌ها

صفحه

عنوان

فصل اول

مقدمه

- ۱-۱- مقدمه‌ای بر پلاسمون‌های سطحی و اثرات مگنتواپتیک ۱
- ۲-۱- نظریه پلاسمون‌های سطحی ۸
- ۳-۱- تحریک پلاسمون‌های سطحی ۱۱
- ۴-۱- سیستم‌های چند لایه ۱۲
- ۵-۱- مدل ریاضی تابع دی‌الکتریک فلز ۱۳
- ۶-۱- اثرات مگنتواپتیک ۱۵
- ۷-۱- ساختار رساله ۱۶

فصل دوم

روش‌های عددی مناسب برای تحلیل ساختارهای چند لایه پلاسموری

- ۱-۲- مقدمه ۱۹
- ۲-۲- روش حل رابطه پاشندگی (معادله مشخصه) موجبرهای پلاسمونیک مگنتواپتیک ۱۹
- ۳-۲- روش عددی تفاضل محدود در حوزه زمان ۲۱
- ۴-۲- نتیجه‌گیری ۲۵

فصل سوم

رابطه پاشندگی سیستم‌های چند لایه‌ی پلاسمونیک مگنتواپتیک

- ۱-۳- مقدمه ۲۷
- ۲-۳- موجبر لایه‌ای پلاسموریک مگنتواپتیک با بایاس عرضی ۲۸

- ۳-۳- موجبر لایه‌ای پلاسموریک مگنتوآپتیک با بایاس طولی ۳۲
- ۴-۳- توزیع میدان در موجبرهای مگنتوآپتیک ۳۵
- ۱-۴-۳- توزیع میدان در موجبرهای پلاسموریک مگنتوآپتیک با بایاس عرضی ۴۱
- ۲-۴-۳- توزیع میدان در موجبرهای پلاسموریک مگنتوآپتیک با بایاس طولی ۴۷
- ۵-۳- نتیجه‌گیری ۵۳

فصل چهارم

کاربرد موجبرهای پلاسمونیک مگنتوآپتیک

- ۱-۴- مقدمه ۵۵
- ۲-۴- مبدل TM به TE با قابلیت تمرکز بالا بر اساس اثرات مگنتوآپتیک ۵۶
- ۳-۴- سویچ SPP مگنتوآپتیک کوچک با سرعت بالا ۶۳
- ۱-۳-۴- تشریح بیکربندی سویچ MOSP ۶۳
- ۲-۳-۴- رابطه‌ی پاشندگی ساختار سویچ MOSP ۶۵
- ۳-۳-۴- ضریب بازتاب کلی لایه‌های سویچ MOSP ۶۶
- ۴-۳-۴- بررسی رفتار انتشاری سویچ MOSP ۶۷
- ۵-۳-۴- شرایط تحریک سویچ MOSP ۷۳
- ۶-۳-۴- تحلیل توارى سویچ MOSP ۷۶
- ۷-۳-۴- عملکرد سویچ MOSP ۷۷
- ۴-۴- طراحی ادوات موجبری پلاسموریک بر اساس ایجاد اختلاف ۷۹
- ۵-۴- امکان سنجی طراحی ایزولاتور پلاسموریک مگنتوآپتیک ۸۸
- ۶-۴- نتیجه‌گیری ۹۱

فصل پنجم

نتیجه‌گیری و پیشنهادها

- ۱-۵- نتیجه‌گیری ۹۳
- ۲-۵- پیشنهادها ۹۶

| | |
|--|-----|
| پیوست ۱: رابطه پاشندگی SPP های منتشره در سطح بین دو محیط..... | ۹۷ |
| پیوست ۲: رابطه پاشندگی سیستم‌های چند لایه..... | ۱۰۱ |
| پیوست ۳: خواص ماده با قابلیت مگنتوپتیک، YIG..... | ۱۰۳ |
| پیوست ۴: روش عددی تفاضل محدود در حوزه زمان..... | ۱۰۷ |
| پیوست ۵: رابطه‌ی پاشندگی موجبر لایه‌ای پلاسموریک مگنتوپتیک با بایس عرضی..... | ۱۱۵ |
| پیوست ۶: رابطه‌ی پاشندگی موجبر لایه‌ای پلاسموریک مگنتوپتیک با بایس طولی..... | ۱۱۹ |
| پیوست ۷: رابطه‌ی پاشندگی ساختار موجبری سویچ MOSP..... | ۱۲۵ |
| لیست مقاله‌ها..... | ۱۳۱ |
| مرجع‌ها..... | ۱۳۳ |

فهرست شکل‌ها

شکل (۱-۱) حدود سرعت عملکرد و ابعاد تراشه براساس فناوری‌های مختلف در ساخت.

۲۰.....

شکل (۲-۱) ساختار موجبرهای پلاسمونی سطحی (الف) عایق-فلز-عایق و (ب) فلز-عایق-فلز.

۳.....

شکل (۳-۱) ساختار دو لایه ای که لایه اول، فلز فرومغناطیس کبالت با بایاس مغناطیسی طولی و لایه دیگر ماده همسانگرد MgF_2 ، و ماده ناهمسانگرد TiO_2 است که بر روی بستر شیشه ای قرار گرفته‌اند، (الف) تزویج از طریق فلز فرومغناطیس و (ب) تزویج از طریق ماده MgF_2 و ماده TiO_2 .

۵.....

شکل (۴-۱) ساختار تزویج کننده منشوری مگنتوآپتیکی کرچمن، متشکل از فیلم های چند لایه فلزات ناب و فلز فرومغناطیس برای افزایش کیفیت عامل تشدید در هنگام تزویج موج الکترومغناطیسی برای تحریک پلاسمون سطحی.

۶.....

شکل (۵-۱) برش عرضی موجبر شکاف دار نیمه‌رسانا با تلفات کمتر در فرکانس های نوری که هسته دی الکتریک با عرض w و ثابت دی الکتریک ϵ_{r1} ، محصور بین دو لایه نیمه رسانا ب ا تانسور دی الکتریک ϵ_{r2} است

۸.....

شکل (۶-۱) ایزولاتور SPP پیشنهادی براساس تزویج غیرمتقابل (الف) ساختار و (ب) عملکرد در جهت رفت.

۸.....

شکل (۷-۱) انتشار SPP ها بصورت نوسان‌های بار در سطح مشترک فلز و عایق.

۹.....

شکل (۸-۱) کاهش دامنه ی میدان در دو ناحیه (ب) توزیع عرضی میدا ن‌های الکترومغناطیسی درمرز فلز و عایق.

۹.....

شکل (۹-۱) پاشندگی پلاریتون پلاسمون‌های سطحی در مقایسه با موج صفحه ای (خط نور) برای فصل مشترک نقره با سیلیکون، ($\epsilon_r = 2.25$) (منحنی سیاه) و هوا، ($\epsilon_r = 1$) (منحنی خاکستری).

۱۰.....

شکل (۱۰-۱) تحریک پلاسمون‌های سطحی با استفاده از منشور (الف) با فاصله هوایی (ساختار اتو) (ب) بدون فاصله هوایی (ساختار کرچمن).

۱۲.....

شکل (۱۱-۱) ساختار هندسی یک موجبر سه لایه IMI یا MIM.

۱۲.....

شکل (۱-۳) موجبر سه لایه پلاسمونیک مگنتوآپتیک با بایاس عرضی.

۲۸.....

شکل (۲-۳) موجبر سه لایه پلاسمونیک مگنتوآپتیک با بایاس طولی.

۳۲.....

شکل (۳-۳) دامنه میدان H_y ، مد (الف) زوج و (ب) فرد برای یک موجبر IMI که لایه طلا با ضخامت ۱۰۰ نانومتر بین دو لایه عایق محصور شده است.

۳۷.....

شکل (۴-۳) مقدار دامنه رابطه پاشندگی ($\epsilon-1$)، بر حسب بخش حقیقی ثابت انتشار مؤثر برای مقادیر مختلف بخش موهومی در طول موج ۱۵۵۰ نانومتر، برای یک موجبر IMI با لایه نقره به ضخامت ۴۰ نانومتر بین دو لایه عایق.

۳۸.....

شکل (۳-۵) مقدار دامنه رابطه پاشندگی (۱-۶)، بر حسب بخش حقیقی ثابت انتشار مؤثر برای مقادیر مختلف بخش موهومی در طول موج ۱۵۵۰ نانومتر، برای یک موجبر MIM با لایه عایق به ضخامت ۴۰۰ نانومتر بین دو لایه طلا. ۳.۹.....

شکل (۳-۶) بخش (الف) حقیقی و (ب) موهومی ثابت انتشار بر حسب ضخامت لایه ی میانی برای مدهای زوج و فرد یک موجبر IMI با لایه طلا محصور بین دو لایه عایق، در طول موج ۱۵۵۰ نانومتر. ۳.۹.....

شکل (۳-۷) دامنه و توزیع میدان H_y مد (الف) زوج و (ب) فرد برای یک موجبر IMI با لایه طلا به ضخامت ۱۰ نانومتر بین دو لایه عایق در طول موج ۱۵۵۰ نانومتر. ۴.۲.....

شکل (۳-۸) بخش (الف) حقیقی و (ب) موهومی ثابت انتشار بر حسب ضخامت لایه ی میانی برای مد زوج یک موجبر MIM با لایه عایق محصور بین دو لایه طلا، در طول موج ۱۵۵۰ نانومتر. ۴.۱.....

شکل (۳-۹) دامنه و توزیع میدان (الف) H_y و (ب) E_x مد زوج برای یک موجبر MIM با لایه عایق با ضخامت ۱۲۰ نانومتر محصور بین دو لایه طلا، در طول موج ۱۵۵۰ نانومتر. ۴۲.....

شکل (۳-۱۰) بخش (الف) حقیقی و (ب) موهومی ثابت انتشار بر حسب ضخامت لایه ی میانی برای مدهای زوج و فرد یک موجبر IMI با لایه طلا محصور بین دو لایه YIG با میدان مغناطیس‌کنندگی در جهت مثبت y ، در طول موج ۱۵۵۰ نانومتر. ۴۳.....

شکل (۳-۱۱) بخش (الف) حقیقی و (ب) موهومی ثابت انتشار بر حسب ضخامت لایه ی میانی برای مدهای زوج و فرد یک موجبر IMI با لایه طلا محصور بین دو لایه YIG با میدان مغناطیس‌کنندگی در راستای y و جهت‌های متفاوت، در طول موج ۱۵۵۰ نانومتر. ۴.۳.....

شکل (۳-۱۲) بخش (الف) حقیقی و (ب) موهومی ثابت انتشار بر حسب ضخامت لایه ی میانی برای مد زوج یک موجبر MIM با لایه YIG محصور بین دو لایه طلا با میدان مغناطیس‌کنندگی در راستای y در جهت‌های متفاوت، در طول موج ۱۵۵۰ نانومتر. ۴۴.....

شکل (۳-۱۳) بخش (الف) حقیقی و (ب) موهومی ثابت انتشار بر حسب ضخامت لایه ی میانی برای مد زوج یک موجبر MIM با لایه YIG محصور بین دو لایه نقره و آلومینیوم با میدان مغناطیس‌کنندگی در راستای y و جهت‌های متفاوت، در طول موج ۱۵۵۰ نانومتر. ۴.۵.....

شکل (۳-۱۴) بخش (الف) حقیقی و (ب) موهومی ثابت انتشار بر حسب ضخامت لایه ی میانی برای مدهای زوج و فرد یک موجبر MIM با لایه عایق محصور بین دو لایه طلا و کبالت با میدان مغناطیس‌کنندگی در راستای y و جهت‌های متفاوت، در طول موج ۱۵۵۰ نانومتر. ۴۵.....

شکل (۳-۱۵) بخش (الف) حقیقی و (ب) موهومی ثابت انتشار بر حسب ضخامت لایه ی میانی برای مد زوج یک موجبر MIM با لایه عایق محصور بین دو لایه آلومینیوم و کبالت با میدان مغناطیس‌کنندگی در راستای y و جهت‌های متفاوت، در طول موج ۱۵۵۰ نانومتر. ۴۶.....

شکل (۳-۱۶) بخش (الف) حقیقی و (ب) موهومی ثابت انتشار بر حسب ضخامت لایه ی میانی برای مد زوج یک موجبر MIM با لایه عایق محصور بین دو لایه طلا و کبالت با میدان مغناطیس‌کنندگی در راستای y و جهت‌های متفاوت، در طول موج ۱۵۵۰ نانومتر. ۴۶.....

- شکل (۳-۱۷) بخش (الف) حقیقی و (ب) موهومی ثابت انتشار بر حسب ضخامت لایه ی میانی برای مد زوج یک موجبر MIM با لایه عایق و YIG به ترتیب محصور بین دو لایه ی کبالت و طلا با مغناطیس شدگی در جهت مثبت x ، در طول موج ۱۵۵۰ نانومتر..... ۴۷
- شکل (۳-۱۸) دامنه و توزیع میدان (الف) H_y و (ب) H_z مد زوج برای یک موجبر MIM با لایه عایق به ضخامت ۱۰۰ نانومتر محصور بین دو لایه کبالت با مغناطیس شدگی در جهت مثبت x ، در طول موج ۱۵۵۰ نانومتر..... ۴۸
- شکل (۳-۱۹) (الف) دامنه و (ب) توزیع میدان H_y ، بخش حقیقی H_y و H_z مد فرد برای یک موجبر IMI با لایه طلا به ضخامت ۵۰ نانومتر محصور بین دو لایه YIG با مغناطیس شدگی در جهت مثبت x ، در طول موج ۱۵۵۰ نانومتر..... ۴۹
- شکل (۳-۲۰) (الف) دامنه و (ب) توزیع میدان H_y ، بخش حقیقی H_y و H_z مد زوج برای یک موجبر IMI با لایه طلا به ضخامت ۵۰ نانومتر محصور بین دو لایه YIG با مغناطیس شدگی در جهت مثبت x ، در طول موج ۱۵۵۰ نانومتر..... ۵۰
- شکل (۳-۲۱) دامنه میدان H_y و H_z مدهای (الف) زوج (ب) فرد برای یک موجبر IMI با لایه کبالت به ضخامت ۵۰ نانومتر محصور بین دو لایه عایقی با مغناطیس شدگی در جهت مثبت x ، در طول موج ۱۵۵۰ نانومتر..... ۵۱
- شکل (۳-۲۲) بخش حقیقی ثابت انتشار بر حسب ضخامت لایه ی میانی یک موجبر IMI با استفاده از سه روش ماتریس انتقال پیشنهادی توسط واسل، روش عددی FDTD و الگوریتم بکار گرفته شده در این رساله..... ۵۲
- شکل (۳-۲۳) بخش حقیقی ثابت انتشار بر حسب ضخامت لایه ی میانی یک موجبر MIM با استفاده از سه روش ماتریس انتقال پیشنهادی توسط واسل، روش عددی FDTD و الگوریتم بکار گرفته شده در این رساله..... ۵۳
- شکل (۴-۱) ضریب تمرکز بر حسب ضخامت لایه ی میانی برای مدهای SPP برای موجبر (الف) MIM با لایه ی عایق محصور بین دولایه ی طلا و (ب) IMI با لایه ی طلا محصور بین دو لایه ی عایق، در طول موج ۱۵۵۰ نانومتر..... ۵۶
- شکل (۴-۲) نسبت ضریب تمرکز موجبر MIM به موجبر IMI شکل (۴-۱)، بر حسب ضخامت لایه ی میانی، در طول موج ۱۵۵۰ نانومتر..... ۵۷
- شکل (۴-۳) دامنه و توزیع میدان (الف) H_y و (ب) H_z مد زوج برای یک موجبر MIM با لایه YIG به ضخامت ۱۲۰ نانومتر محصور بین دو لایه طلا با مغناطیس شدگی در جهت مثبت x ، در طول موج ۱۵۵۰ نانومتر..... ۵۸
- شکل (۴-۴) تضعیف توان مد (MPA) بر حسب ضخامت لایه ی میانی برای مد زوج یک موجبر MIM با لایه عایق و YIG به ترتیب محصور بین دو لایه ی کبالت و طلا با مغناطیس شدگی در جهت مثبت x ، در طول موج ۱۵۵۰ نانومتر..... ۶۰

شکل (۴-۵) طول انتشار بر حسب ضخامت لایه ی میانی برای مد زوج یک موجبر MIM با لایه عایق و YIG به ترتیب محصور بین دو لایه ی کبالت و طلا با مغناطیس شدگی در جهت مثبت x ، در طول موج ۱۵۵۰ نانومتر..... ۶۰

شکل (۴-۶) گسترش فضایی (SE) بر حسب ضخامت لایه ی میانی برای مد زوج یک موجبر MIM با لایه عایق و YIG به ترتیب محصور بین دو لایه ی کبالت و طلا با مغناطیس شدگی در جهت مثبت x ، در طول موج ۱۵۵۰ نانومتر..... ۶۱

شکل (۴-۷) مقدار بیشینه ی مؤلفه ی مد TE، H_z ، بر حسب ضریب تزویج یا عنصر غیر قطری تانسور دی الکتریک ϵ_{yz} ، برای موجبر شکل (۴-۳)..... ۶۱

شکل (۴-۸) مقدار عنصر غیر قطری تانسور دی الکتریک، ϵ_{yz} بر حسب فرکانس زاویه ای برای ماده YIG با چرخش فرادی $\theta_F = 3600/cm$ ۶۲

شکل (۴-۹) دامنه و توزیع میدان بخش حقیقی (الف) E_y و (ب) E_x مد زوج برای یک موجبر MIM با لایه YIG به ضخامت ۱۲۰ نانومتر محصور بین دو لایه طلا با مغناطیس شدگی در جهت مثبت x ، در طول موج ۱۵۵۰ نانومتر..... ۶۳

شکل (۴-۱۰) (الف) طرحواره و (ب) نمایی از سطح مقطع سویچ MOSP پیشنهادی..... ۶۴

شکل (۴-۱۱) ساختار هندسی مورد استفاده برای تحلیل سویچ MOSP..... ۶۶

شکل (۴-۱۲) (الف) دامنه و (ب) و توزیع میدان مغناطیسی H_y مد زوج برای ساختار سویچ MOSP شامل لایه های YIG و طلا به ترتیب به ضخامت های ۸۰ و ۴۰ نانومتر، در طول موج ۱۵۵۰ نانومتر..... ۶۸

شکل (۴-۱۳) (الف) دامنه و (ب) و توزیع میدان مغناطیسی H_z مد زوج برای ساختار سویچ MOSP که شامل لایه های YIG و طلا به ترتیب به ضخامت های ۸۰ و ۴۰ نانومتر، در طول موج ۱۵۵۰ نانومتر..... ۶۹

شکل (۴-۱۴) مقدار بیشینه ی مؤلفه ی مد TE، H_z ، بر حسب ضریب تزویج یا عنصر غیر قطری تانسور دی الکتریک رابطه ی (۳-۲۸)، ϵ_{yz} برای سویچ MOSP..... ۶۹

شکل (۴-۱۵) بخش (الف) حقیقی و (ب) موهومی ثابت انتشار بر حسب ضخامت لایه ی میانی برای مد زوج پیکربندی سویچ MOSP با ضخامت لایه های طلای ۴۰ نانومتر، در طول موج های مختلف..... ۷۰

شکل (۴-۱۶) بخش (الف) حقیقی و (ب) موهومی ثابت انتشار بر حسب ضخامت لایه ی میانی برای مد زوج پیکربندی سویچ MOSP با ضخامت لایه های طلای ۴۰ نانومتر، برای مقادیر مختلفی از عنصر غیر قطری تانسور دی الکتریک نسبی در طول موج ۱۵۵۰ نانومتر..... ۷۱

شکل (۴-۱۷) بخش (الف) حقیقی و (ب) موهومی مؤلفه ی z بردار موج در لایه ی YIG بر حسب ضخامت لایه ی میانی برای مد زوج پیکربندی سویچ MOSP با ضخامت لایه های طلا ۴۰ نانومتر، برای مقادیر مختلفی از عنصر غیر قطری تانسور دی الکتریک نسبی در طول موج ۱۵۵۰ نانومتر..... ۷۲

شکل (۴-۱۸) ضریب بازتاب بر حسب زاویه ی تابش مد زوج پیکربندی سویچ MOSP شامل لایه ی YIG به ضخامت های ۵۰ و ۶۰ نانومتر با ضخامت لایه ی طلا (الف) ۳۰، (ب) ۳۵ و (ج) ۴۰ نانومتر، در طول موج ۱۵۵۰ نانومتر..... ۷۴

- شکل (۴-۱۹) بازتاب کلی نور تابشی بر حسب زاویه ی تابش در سویچ MOSP برای لایه‌های طلا به ضخامت ۳۵ نانومتر و لایه‌ی YIG به ضخامت ۵۰ نانومتر، در طول موج‌های مختلف..... ۷۵
- شکل (۴-۲۰) مقدار بیشینه ی مؤلفه ی مد TE_0 ، H_z ، بر حسب ضخامت لایه ی میانی در سویچ MOSP برای لایه‌های طلا به ضخامت ۳۵ نانومتر، در طول موج‌های مختلف..... ۷۵
- شکل (۴-۲۱) تضعیف توان مد (MPA) بر حسب ضخامت لایه ی میانی در سویچ MOSP برای لایه های طلا به ضخامت ۳۵ نانومتر، در طول موج‌های مختلف..... ۷۶
- شکل (۴-۲۲) طول انتشار بر حسب ضخامت لایه ی میانی در سویچ MOSP برای لایه‌های طلا به ضخامت ۳۵ نانومتر، در طول موج‌های مختلف..... ۷۷
- شکل (۴-۲۳) گسترش فضایی بر حسب ضخامت لایه ی میانی در سویچ MOSP برای لایه های طلا به ضخامت ۳۵ نانومتر، در طول موج‌های مختلف..... ۷۷
- شکل (۴-۲۴) عملکرد سویچ MOSP در حالت (الف) خاموش و (ب) روشن..... ۷۸
- شکل (۴-۲۵) ساختار هندسی موجبر پلاسمونیک مگنتوپتیک (الف) بدون و (ب) با مغناطیس‌شدگی..... ۷۹
- شکل (۴-۲۶) دامنه و توزیع میدان H_y برای دو حالت (الف) انتشار و (ب) قطع مد زوج یک موجبر IMI نامتقارن مشابه شکل (۴-۲۵-الف)، با ضخامت لایه‌ی میانی ۱۰ نانومتر، در طول موج ۱۵۵۰ نانومتر..... ۸۱
- شکل (۴-۲۷) بخش حقیقی ثابت انتشار بر حسب ضخامت لایه‌ی میانی برای موجبر IMI متقارن با لایه‌ی نقره محصور بین دولایه‌ی عایق مشابه، در طول موج ۱۵۵۰ نانومتر..... ۸۱
- شکل (۴-۲۸) بخش حقیقی ثابت انتشار بر حسب اختلاف ثابت دی الکتریک دو لایه ی کناری، برای مد فرد موجبر IMI نامتقارن شکل (۴-۲۵-الف)، برای ضخامت های مختلف لایه ی فلزی، در طول موج ۱۵۵۰ نانومتر..... ۸۲
- شکل (۴-۲۹) گسترش فضایی بر حسب اختلاف ثابت دی الکتریک دو لایه‌ی کناری، برای مد فرد موجبر IMI نامتقارن شکل (۴-۲۵-الف)، برای ضخامت‌های مختلف لایه‌ی فلزی، در طول موج ۱۵۵۰ نانومتر..... ۸۳
- شکل (۴-۳۰) بخش حقیقی ثابت انتشار بر حسب اختلاف ثابت دی الکتریک دو لایه ی کناری، برای مد زوج موجبر IMI نامتقارن شکل (۴-۲۵-الف)، برای ضخامت های مختلف لایه ی فلزی، در طول موج ۱۵۵۰ نانومتر..... ۸۳
- شکل (۴-۳۱) گسترش فضایی بر حسب اختلاف ثابت دی الکتریک دو لایه‌ی کناری، برای مد زوج موجبر IMI نامتقارن شکل (۴-۲۵-الف)، برای ضخامت‌های مختلف لایه‌ی فلزی، در طول موج ۱۵۵۰ نانومتر..... ۸۴
- شکل (۴-۳۲) تلفات در واحد طول (MPA) بر حسب اختلاف ثابت دی الکتریک دو لایه‌ی کناری، برای مد زوج موجبر IMI نامتقارن شکل (۴-۲۵-الف)، برای ضخامت های مختلف لایه ی فلزی، در طول موج ۱۵۵۰ نانومتر..... ۸۴
- شکل (۴-۳۳) ضریب تمرکز بر حسب اختلاف ثابت دی الکتریک دو لایه‌ی کناری، برای مد زوج موجبر IMI نامتقارن شکل (۴-۲۵-الف)، برای ضخامت‌های مختلف لایه‌ی فلزی، در طول موج ۱۵۵۰ نانومتر..... ۸۵

شکل (۴-۳۴) بخش حقیقی مؤلفه‌ی z بردار موج در لایه‌ی (الف) اول و (ب) دوم بر حسب اختلاف ثابت دی‌الکتریک دو لایه‌ی کناری، برای مد زوج موجبر IMI نامتقارن شکل (۴-۲۵-الف)، برای ضخامت‌های مختلف لایه‌ی فلزی، در طول موج ۱۵۵۰ نانومتر..... ۸۵

شکل (۴-۳۵) توزیع میدان، H_y برای مقادیر مختلف ثابت دی‌الکتریک لایه‌ی Bi-YIG و ضخامت لایه‌ی نقره، ۳۰ نانومتر، در طول موج ۱۵۵۰ نانومتر..... ۸۷

شکل (۴-۳۶) (الف) $\Delta\epsilon$ و (ب) ϵ_{eff3} بر حسب $|\epsilon_{xz}|$ ۸۷

شکل (۴-۳۷) بخش حقیقی ثابت انتشار بر حسب اختلاف بین ثابت‌های دی‌الکتریک، $\Delta\epsilon$ در موجبر (۴-۲۵-ب) با فیلم نقره‌ای به ضخامت ۱۰ نانومتر، برای طول‌موج‌های مختلف..... ۸۸

شکل (۴-۳۸) اختلاف بخش (الف) حقیقی و (ب) موهومی ثابت انتشار بر حسب ضخامت لایه‌ی میانی برای مد‌های زوج و فرد یک موجبر IMI با لایه‌ی طلا محصور بین دو لایه‌ی YIG برای جهت‌های مغناطیس‌شدگی متفاوت، در طول موج ۱۵۵۰ نانومتر..... ۸۹

شکل (۴-۳۹) مقایسه طول لازم برای به دست آوردن جابجایی فاز $\frac{\pi}{2}$ با طول انتشار بر حسب ضخامت لایه‌ی میانی برای مد زوج یک موجبر IMI با لایه‌ی طلا محصور بین دو لایه‌ی YIG، در طول موج ۱۵۵۰ نانومتر..... ۸۹

شکل (۴-۴۰) اختلاف بخش (الف) حقیقی و (ب) موهومی ثابت انتشار بر حسب ضخامت لایه‌ی میانی برای مد زوج یک موجبر MIM با لایه‌ی عایق محصور بین دو لایه‌ی آلومینیوم و کبالت برای جهت‌های مغناطیس‌شدگی متفاوت، در طول موج ۱۵۵۰ نانومتر..... ۹۰

شکل (۴-۴۱) مقایسه طول لازم برای به دست آوردن جابجایی فاز $\frac{\pi}{2}$ با طول انتشار بر حسب ضخامت لایه‌ی میانی برای مد زوج یک موجبر MIM با لایه‌ی عایق محصور بین دو لایه‌ی آلومینیوم و کبالت، در طول موج ۱۵۵۰ نانومتر..... ۹۱

شکل (پ-۱-۱) ساختار یک موجبر لایه‌ای عایق (II-فلز (I)، که موج در آن در جهت x منتشر می‌شود..... ۹۸

شکل (پ-۴-۱) سلول استاندارد Yee..... ۱۱۰

شکل (پ-۴-۲) شکل موج گاوسی، مشتق پالس گاوسی و پالس گاوسی مدوله شده با موج سینوسی، با عرض پالس ۲ نانوثانیه در فرکانس مرکزی ۲۰۰ میکروثانیه در مدت زمان ۱۰ نانوثانیه..... ۱۱۲

فهرست جدول‌ها

- جدول (۱-۳) مقادیر ثابت های دی الکتریک نسبی محیط های عایق، فلز، عنصرهای قطری و غیرقطری تانسورهای دی الکتریک مواد مگنتوآپتیک در طول موج ۱۵۵۰ نانومتر. ۳۶
- جدول (۲-۳) شرایط وجودی مدهای زوج و فرد در موجبرهای IMI و MIM. ۳۷
- جدول (۳-۳) مقدار ثابت انتشار موجبرهای IMI شکل های (۱۹-۳)-(۲۱-۳). ۵۲
- جدول (۱-۴) پارامترهای درود برای فلز طلا. ۶۷
- جدول (۲-۴) پارامترهای درود برای فلز نقره. ۷۹
- جدول (پ-۳-۱) خصوصیات مگنتوآپتیکی فیلم های Bi-RIG. ۱۰۴

فصل اول

مقدمه

۱-۱- مقدمه‌ای بر پلاسمون‌های سطحی و اثرات مگنتواپتیک

امکان مهندسی در مقیاس مولکولی برای اولین بار توسط ریچارد فاینمن^۱، برنده جا ئزه نوبل فیزیکی مطرح شد. فاینمن طی یک سخنرانی با عنوان "فضای زیاد در سطوح پایین" در انستیتو فناوری کالیفرنیا در سال ۱۹۵۹ اشاره کرد که اصول و مباحث فیزیکی، امکان ساخت اتم به اتم اجسام را رد نمی‌کند. وی اظهار نمود که می‌توان با استفاده از ماشین‌ها ی کوچک ماشین‌ها یی به مراتب کوچکتر ساخت و سپس این کاهش ابعاد را تا سطح خود اتم ادامه داد. این نظریه که پایه شاخه ای جدیدی از فناوری با عنوان نانوفناوری شد، در دهه ۱۹۸۰ به حقیقت پیوست . دانشمندان در سال ۱۹۹۰ در مرکز تحقیقات IBM توانستند اتم‌ها را حرکت دهند و با اتم جمله‌ای^۲ را بنویسند.

نانوفناوری مهندسی سیستم‌های عملکردی در مقیاس مولکول است. این فناوری مورد توجه محققان عصر کنونی است. یکی از بارزترین برجستگی‌های این فناوری کوچکتر شدن قطعه‌ها است.

¹ R. Feynman

² THIS IS FUN